

TL2000

Система тестирования
оптоэлектронных компонентов



ficonTEC
micro assembly machines

TL2000 Система тестирования оптоэлектронных компонентов

Данная серия измерительного оборудования ficonTEC предназначена для автоматизированной электрооптической характеристики полупроводниковых кристаллов. FiconTEC TL2000 – полностью автоматизированная система тестирования и контроля для несмонтированных лазерных диодов отдельных кристаллов и кристаллов на подложках.

Система может быть настроена для выполнения измерений параметров лазерного диода или каждого отдельного излучателя. К стандартным измерениям относятся LIV-тесты, спектральная характеристика и инспекция распределения поля.



Устройство захвата

Вакуумный держатель

Вакуумный держатель с контролем температуры – это элемент ответственный за надежную фиксацию тестируемого устройства и контроль температуры

- Сменный держатель позволяет работать с различными конструкциями тестируемых устройств
- Возможны различные варианты держателей
- Температурный диапазон от 20° до 60°
- Стабильность температуры +/- 1°C
- Малые габариты обеспечивают быстроту импульсов тока
- Возможны различные варианты держателей

Камера для испытаний

Камера для испытаний – это область где осуществляется определение характеристик тестируемого устройства.

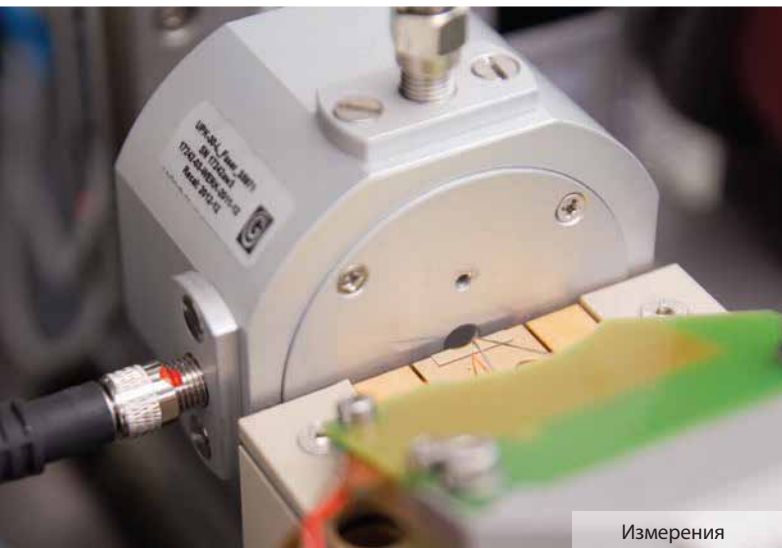
- Конструкция, обеспечивающая защиту от факторов риска, связанных с лазерным излучением. (Лазер класса 1)
- Сменная измерительная головка
- Электронное регулирование нагрузки
- Камера для автоматизированного контроля и наблюдения
- Интегрирующая сфера с возможностями для охлаждения пластин управления



Вакуумный держатель

Корпус и управление

- Стальная рама
- Закрытое рабочее пространство с пневматической сдвижной дверцей
- Система управления с компьютером
- Два ЖК дисплея 17", клавиатура и трекбол
- Система контроля линейных и угловых перемещений
- Пневматическая панель управления



Применение

- Определение электрооптических характеристик несмонтированных лазерных диодов
- Определение характеристик полупроводникового лазера
- Характеризация отдельных кристаллов
- Тестирование фотодиодов
- Тестирование кристаллов на подложке
- Полное тестирование высокоомощных диодов

Технология измерений

Драйвер тока, фотометрический шар фотодиоды спектральные анализаторы и измерительное оборудование подбирается в соответствии с требованиями заказчика Действуют следующие ограничения

- Диапазон тока: 0 - 5 А
- Выше по запросу 0-100 А
- Ширина импульса 500 нс – 100 мс
- Спектральный диапазон 100 нм за пределами 350 нм



Ключевые характеристики

- Испытание интенсивности света, тока, напряжения, тестирование спектрального ближнего и дальнего поля.
- Полностью автоматическое перемещение устройств
- Сменная измерительная головка
- Варианты для инспекции верхней стороны и граней
- Гибкая интеграция внешних алгоритмов и систем испытаний
- Совместимость я SQL и другими базами данных

TL2000

TL2000 Система перемещения

Характеристики	Ось X, Y, Z	Ось Phi-Z
• Ход	800, 200, 100 мм	270°
• Разрешение	100 нм	2 сек
• Повторяемость	± 1 мкм	8 сек

Простой рабочий интерфейс

В качестве уникальной характеристики все системы предлагают комплексное отслеживание компонентов во всех процессах и на всех машинах.

На всех системах установлено одинаковое программное обеспечение для простоты эксплуатации и совместимости.



Свяжитесь с нами



РОССИЯ, ТБС
105064, Москва, Нижний Сусальный пер. 5, стр. 4
Телефон: +7 495 287 8577, +7 495 783 0284
Электронная почта: infos@tbs-semi.ru

www.ficontec.com



ISO 9001 Certification

ficonTEC Service GmbH is licensed to ISO 9001:2008 certification, by DNV GL/Hamburg, Germany.